УДК 620.179

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИКЛЕИВАЕМОГО И ПРИМАГНИЧИВАЕМОГО ЦТС-ДАТЧИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА В ЦЕЛЯХ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

© 2022 г. С.К. Сингх^{1,*}, Р. Шанкер^{1,**}

¹Национальный технологический институт Мотилала Неру в Аллахабаде, Праяградж, 211004 Индия E-mail: *sachin6738@gmail.com; **ramashanker@mnnit.ac.in

Поступила в редакцию 08.07.2022; после доработки 09.08.2022 Принято к публикации 12.08.2022

Метод электромеханического импеданса (ЭМИ) является одним из важных методов в области мониторинга состояния конструкций. Повреждение на начальном этапе может быть легко обнаружено с помощью этого метода по сравнению с другими. Исследователями были предложены различные конфигурации ЦТС-датчиков для метода ЭМИ, которые имеют свои преимущества и недостатки. В данной работе приклеиваемый ЦТС-датчик (КЦД) и примагничиваемый ЦТС-датчик (МЦД) используются для контроля дефектов в стальной балке двутаврового сечения. В балке создаются повреждения, и с помощью статистических методов производится их количественная оценка. При анализе результатов было обнаружено, что МЦД имеет большую зону чувствительности, чем КЦД. Это связано с отсутствием эффекта сдвигового запаздывания в МЦД, чего нет в случае КЦД. Задержка сдвига влияет на механизм передачи деформации между ЦТС-датчиком и объектом, на котором данный датчик и располагается. Область чувствительности МЦД достигает 3,5 м, в то время как область чувствительности КЦД составляет менее 2,0 м в случае стальной балки.

Ключевые слова: контроль состояния конструкций, метод электромеханического импеданса, приклеиваемый ЦТСдатчик, примагничиваемый ЦТС-датчик.

DOI: 10.31857/S0130308222100062, **EDN:** BTKVCC

введение

Многие гражданские инженерные сооружения (такие как мосты, высотные здания, плотины, железные дороги и метро) играют значительную роль для транспортных сетей, социальной жизни и экономики. Срок службы многих из этих сооружений подходит к концу из-за экономической нецелесообразности их реконструкции. Исследователи и инженеры-строители в последнее время уделяют большое внимание контролю состояния конструкций (КСК) для долгосрочного мониторинга и обнаружения потенциальной деградации конструкций. Были разработаны различные методы КСК [1—6], которые должны использоваться в соответствии с требованиями, из которых хорошо зарекомендовал себя метод электромеханического импеданса (ЭМИ) при контроле зарождающихся повреждений, обладая высокой точностью.

Датчики, используемые в методе ЭМИ, обычно приклеиваются к объектам контроля эпоксидной смолой для выявления структурных дефектов. Такие датчики, с другой стороны, уязвимы к повреждениям. Диагностика датчиков — это область исследования, которая сосредоточена на поиске неисправных датчиков. Хотя очевидно, что продолжение создания систем КСК необходимо как по соображениям безопасности, так и по экономическим причинам, создание сенсорной диагностики для этих методов КСК можно считать не менее важным. Диагностика датчиков позволяет системе мониторинга определять целостность датчиков и отличать повреждения датчиков от дефектов конструкции.

Существуют различные типы датчиков, разработанные для решения конкретных задач. Для мониторинга ранней гидратации бетона и состояния конструкций была создана концепция многоразового ЦТС-датчика. Такая схема датчика состоит из ЦТС-элемента, соединенного с корпусом двумя болтами, которые затем затягиваются в отверстиях, просверленных в корпусе [7]. Аналогичный многоразовый датчик был создан с использованием болта, металлического стержня и ЦТС-пластины, которая крепится на болт, который в свою очередь крепится к металлическому стержню. Стержень вставляется в бетон во время заливки, что может быть использовано для мониторинга гидратации цемента. Этот датчик можно использовать повторно, удалив болт [8]. Также был предложен беспроводной датчик, который можно поместить в бетон во время заливки и использовать для мониторинга прочности бетона и его разрушения [9]. Для оценки прочности высокопрочного бетона был предложен встраиваемый ЦТС-датчик, изготовленный из полого полусферического стирола [10]. Для мониторинга раннего нарастания показателей механической прочности цементных материалов был разработан датчик на основе интеллектуального зонда, использующий металлическую полосу с ЦТС-датчиком, приклеенным с одной стороны [11]. Другой датчик был изготовлен в форме кольцевого диска и встроен в конец стального прута для распознавания повреждений вследствие коррозии и образования трещин [12]. Было установлено, что пьезоэлектрический цементный датчик, состоящий из цемента и пьезоэлектрического композита, работает лучше, чем обычный ЦТС-датчик, поскольку у него больше изменение электрического импеданса [13].

Большинство методов обнаружения дефектов требуют большого количества датчиков, рассредоточенных по всей конструкции для достаточного охвата области контроля. Большинство из этих датчиков могут работать в неблагоприятных условиях эксплуатации и окружающей среды. Механические воздействия, аварии или другие непредвиденные чрезвычайные происшествия способны повредить даже датчики, подключенные в безопасном месте. Если датчик, подключенный к системе мониторинга, не выдает никаких выходных сигналов как от окружающей среды, так и от внешнего воздействия, то, скорее всего, датчик был выведен из строя. Даже если датчик каким-то образом повредился, он все равно в некоторой степени работоспособен, может реагировать на внешнее воздействие и выдавать, как кажется, достаточный отклик. Датчик с поломками или недостаточным сцеплением, которые могут быть вызваны воздействием растворителя, ударами и усталостью, может существенно изменить свойства сигнала и привести к ошибочным заключениям о наличии повреждения. Перед каждым измерением состояние каждого датчика должно быть проверено для максимального обеспечения представление о целостности конструкции. Поэтому для преодоления этого недостатка исследователями был предложен примагничиваемый ЦТС-датчик (МЦД), который может применяться, если известно состояние конструкции. Крепление МЦД не требует наличие связующего слоя из эпоксидной смолы, а работа датчика SMPS объясняется в другом разделе.

Влияние связующего слоя на измерения импеданса было изучено рядом исследователей. Bhalla и Soh [4] исследовали влияние сдвига через связующий слой на электромеханические модели импеданса, такие как пьезоэлектрическая активация и зондирование, созданные Crawley и de Luis [5] и Sirohi и Chopra [6] соответственно. Bhalla и Soh [4] показали, что связующий слой может оказывать существенное влияние на наблюдаемые сигналы электрического сопротивления, добавляя эффекты потерь на сдвиг через клей и расширяя предыдущие модели до 2D. Чтобы уменьшить влияние пограничного слоя на регистрируемые данные, авторы рекомендовали использовать тонкий слой клея с высоким модулем сдвига и как можно меньший пьезоэлектрический слой.

В данной работе как КЦД, так и МЦД используются на стальной балке двутаврового сечения, искусственные повреждения создаются в балке путем разрезания в одной точке. Получены зависимости проводимости от частоты в исходном состоянии и на различных стадиях повреждения. Количественная оценка повреждений была выполнена на основе статистического анализа.

МЕТОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА

Пьезоэлектрик обладает свойством изменять форму при приложении к нему электрического потенциала, что называется обратным пьезоэффектом, и, наоборот, генерировать электрический заряд при наведении в нем деформации, что называется прямым пьезоэффектом. Это свойство пьезоэлектрического материала делает его пригодным для использования в качестве датчика и актуатора в области контроля состояния конструкций. Они имеют небольшие размеры, малый вес и обеспечивают лучшую чувствительность.

Согласно данной методике, датчик цирконата-титаната свинца (ЦТС) приклеивается к участку конструкции, данный участок электрически возбуждается с помощью LCR-метра напряжением 1 В в широком диапазоне частот 30—400 кГц, одновременно с этим регистрируется характеристики сигнала для каждой частоты в этом диапазоне. Характеристики сигнала записываются в виде зависимости сопротивления ЦТС-датчика от частоты. Адмиттанс ЦТС-пластины определяет сопротивление объекта, к которому он приклеен, которое зависит от массы, жесткости и демпфирующих свойств материала конструкции. При подаче электрического потенциала на ЦТС-датчик индуцируется деформация, которая далее передается конструкции. После передачи деформации упругие волны распространяются через материал и отражаются от дефектов, границ и любых других препятствий. Возвращаясь обратно, упругие волны собирают информацию о материале, что, в свою очередь, приводит к вибрациям ЦТС-датчика, в котором благодаря прямому воздействию генерируется электрический заряд, регистрируемый в различных диапа-

зонах частот с помощью LCR-метра. Эта последовательность действий повторяется всякий раз, когда необходимо узнать состояние объекта. Любое изменение в форме сигнала по сравнению с ранее полученной свидетельствует о повреждении конструкции. Для количественной оценки повреждений, определения местоположения повреждений и оценки оставшегося срока службы конструкции были проведены многочисленные исследования [14—20]. За последние два десятилетия такая методика получила большее развитие для комплексного использования в данной области [21-26]. Начальный уровень трещин или любые незначительные изменения в конструкции легко обнаруживаются. Более поздние исследования также показали его эффективность для глобальных повреждений, а также для более низкого диапазона частот [27]. Эти сигналы уникальны для конструкции, если только конструкция не претерпела физических изменений, таких как изменение температуры, жесткости, массы или демпфирования, во время которых формы сигналов не остаются такими же и изменяются. В результате любое повреждение конструкции вызывает изменения в связанных с ней структурных параметрах, которые впоследствии могут быть замечены как изменение параметров адмиттанса конструкции. Метод ЭМИ очень чувствителен к ранним признакам повреждения. В результате раннее обнаружение и быстрое реагирование могут предотвратить его дальнейшее распространение и полное разрушение конструкции.

Liang [28] впервые предложил одномерную импедансную модель электромеханической системы. ЦТС-датчик считается бесконечно малым по сравнению со всей конструкцией, поэтому его масса и жесткость не учитываются. Переменное электрическое поле прикладывается в направлении '3', как показано на рис. 1, что приводит к колебаниям ЦТС в направлении '1'. ЦТС-дачтик закреплен с одной стороны, а другая сторона испытывает импеданс Z от объекта. ЦТС-пластина действует как тонкий стержень, испытывающий осевые колебания. Электромеханическая модель показана на рис. 1. Ее комплексный коэффициент передачи определяется согласно уравнению:

$$\overline{Y} = 2\omega j \frac{wl}{h} \left[\left(\overline{\varepsilon_{33}^T} - d_{31}^2 \overline{Y^E} \right) + \left(\frac{Z_a}{Z + Z_a} \right) d_{31}^2 \overline{Y^E} \left(\frac{\tan \kappa l}{\kappa l} \right) \right], \tag{1}$$

где \overline{Y} — адмиттанс (обратный импеданс); $\overline{Y^{E}}$ — модуль Юнга; d_{31} представляет пьезомодуль; $\overline{\varepsilon_{33}^{T}}$ — комплексная диэлектрическая постоянная ЦТС в отсутствии механических напряжений соответственно; d — это тангенс угла диэлектрических потерь ЦТС; Z и Z_{a} — механический импеданс конструкции и ЦТС-пластины соответственно.



Рис. 1. ЦТС-пластина, приклеенная к объекту.



Рис. 2. 2D-модель импеданса между ЦТС-пластиной и объектом.

В этой точечной модели основным недостатком было то, что ЦТС-пластина считалась приклеенной только на внешней граничной поверхности, в то время как ЦТС-датчик приклеивается к поверхности структуры полностью, что приводит к дальнейшему совершенствованию модели.

Далее Bhalla и Soh [4] предложили 2D-модель импеданса, которая показана на рис. 2, используя идею «эффективного импеданса» и получая следующее выражение для адмиттанса ЦТС-пластины:

$$\overline{Y} = G + Bj = 4\omega j \frac{l^2}{h} \left[\overline{\varepsilon_{33}^T} - \frac{2d_{31}^2 \overline{Y^E}}{(1-\nu)} + \frac{2d_{31}^2 \overline{Y^E}}{(1-\nu)} \left(\frac{Z_{a,eff}}{Z_{s,eff} + Z_{a,eff}} \right) \overline{T} \right],$$
(2)

где \overline{T} — комплексная касательная, а l — половина длины пластины. В свою очередь, адмиттанс, рассчитываемый по уравнению (2), можно разбить на две части:

$$\overline{Y} = \overline{Y}_P + \overline{Y}_A,\tag{3}$$

где \overline{Y}_A — «активная» компонента и \overline{Y}_P — «пассивная» компонента. \overline{Y}_P можно разделить на действительную и мнимую части:

$$\overline{Y}_P = G_P + B_P j; \tag{4}$$

$$G_{P} = \frac{4\omega l^{2}}{h} \left\{ \delta \varepsilon_{33}^{T} + K \eta \right\};$$
(5)

$$B_P = \frac{4\omega l^2}{h} \left\{ \varepsilon_{33}^T - K \right\}; \tag{6}$$

$$K = \frac{2d_{31}^2 Y^E}{(1-\nu)}.$$
(7)

Такая разработанная аналитическая модель показывает хорошую корреляцию с экспериментом.

ЭФФЕКТ СДВИГОВОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ НА МОДЕЛЬ ИМПЕДАНСА

Для моделирования эффекта сдвигового запаздывания на импеданс рассматривался ЦТСдатчик, который показан на рис. 3 и 4. Датчик прикрепляется к объекту с помощью клея и возбуждается источником переменного напряжения. На рис. 4 показана правая половина симметричной системы ЦТС-пластины. Сама пластина считается бесконечно малой. Используя принцип д'Аламбера, уравнение для ЦТС можно записать как

$$\tau w_p dx + (dm) \frac{\partial^2 u_p}{\partial t^2} = \frac{\partial T_p}{\partial x} t_p w_p dx.$$
(8)



Рис. 3. ЦТС-пластина, приклеенная к балке с помощью клея.



Рис. 4. Деформация слоя клея и пластины.

Пластина имеет полудлину l, ширину w_p , толщину h_p , а связующий слой обладает толщиной h_s . Балка имеет глубину h_b и ширину w_b . Пусть T_p — осевое напряжение в ЦТС-пластине; τ — напряжение межфазного сдвига; dm — бесконечно малая масса; u_p обозначает смещение между ЦТС-пластиной и слоем клея; u — смещение между слоем клея и материалом основы. Инерциальным членом пренебрегаем из-за преобладания члена напряжения сдвига в уравнении (8), такое предположение может привести уравнение (8) к виду:

$$\tau = \frac{\partial T_p}{\partial x} t_p. \tag{9}$$

Допуская деформацию чистого сдвига в связующем слое:

$$\tau = \frac{\overline{G_s}\left(u_p - u\right)}{t_s},\tag{10}$$

где $\overline{G_s} = G_s (1 + \eta' j)$ — комплексный модуль сдвига связующего слоя, а η' — тангенс угла механических потерь, связанный с наличием связующего слоя. Осевое напряжение в ЦТС-пластине определяется как

$$T_p = \overline{Y^E} \left(u'_p - \Lambda \right), \tag{11}$$

где $\overline{Y^E}$ — комплексный модуль Юнга ЦТС-пластины; u'_p — деформация ЦТС; $\Lambda = E_3 d_{31}$ — свободная пьезоэлектрическая деформация. Подставляя уравнение (10) и (11) в уравнение (9), мы получим:

$$u_p - u = \left(\frac{\overline{Y^E}t_p t_s}{\overline{G}_s}\right) u_p''.$$
(12)

Сила, которая направлена на объект, связана с полным входным сопротивлением Z объекта следующим образом:

$$F = -Z\dot{u},\tag{13}$$

где *и* — полная скорость на поверхности объекта. Далее уравнение (13) может быть упрощено как

$$T_P w_p t_p = -Z u j \omega. \tag{14}$$

Подставляя уравнение (11) и дифференцируя его по переменной *x*, получаем:

$$u_p'' = -\left(\frac{Zj\omega}{w_p t_p \overline{Y^E}}\right) u'.$$
(15)

В уравнении (12) выразим u''_p :

$$u_p'' = \left(\frac{\overline{G_s}}{\overline{Y^E}t_p t_s}\right) (u_p - u).$$
(16)

Подставим уравнение (16) в уравнение (15) и преобразуем его:

$$u_p - u = -\left(\frac{Zt_s j\omega}{\overline{G_s}w_p}\right)u'.$$
(17)

Продифференцировав уравнение (17) дважды по переменной *x*, получаем:

$$u_p'' = u'' - \left(\frac{Zt_s j\omega}{\overline{G_s} w_p}\right) u'''.$$
(18)

Подставим уравнения (17) и (18) в уравнение (12), затем продифференцируем его по переменной *x*:

$$u''' + \left(-\frac{w_p \overline{G_s}}{Zt_s j\omega}\right) u''' - \left(\frac{\overline{G_s}}{Y^E t_s t_p}\right) u_p'' = 0.$$
⁽¹⁹⁾

Дефектоскопия № 10 2022

Пусть

$$\overline{p} = -\frac{w_p \overline{G_s}}{Z t_s j \omega}.$$
(20)

Подставим Z = x + yi, $(\overline{G}_s) = G_s(1 + \eta' j)$ и упростим:

$$\overline{p} = a + bj, \tag{21}$$

Поскольку η и η' — очень малые величины, коэффициент перед u_p'' можно записать как

$$q = \frac{\overline{G_s}}{Y^E t_s t_p} \approx \frac{G_s}{Y^E t_s t_p}.$$
(23)

Результирующее дифференциальное уравнение (19) можно выразить:

$$u'''' + \overline{p}u''' - qu''_p = 0.$$
(24)

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^4 + \overline{p}\lambda^3 - q\lambda^2 = 0. \tag{25}$$

Решив его, получим корни характеристического уравнения:

$$\lambda_{1} = 0, \lambda_{2} = 0, \lambda_{3} = \frac{-\overline{p} + \sqrt{\overline{p}^{2} + 4q}}{2}, \lambda_{4} = \frac{-\overline{p} - \sqrt{\overline{p}^{2} + 4q}}{2}.$$
(26)

Следовательно, решение дифференциального уравнения (24) можно записать как

$$u = A_1 + A_2 x + B e^{\lambda_3 x} + C e^{\lambda_4 x}.$$
 (27)

Константы А, В и С определяются, исходя из начальных условий.

Дифференцируя по переменной *x*, получаем:

$$u' = A_2 + B\lambda_3 e^{(\lambda_3 x)} + C\lambda_4 e^{(\lambda_4 x)}.$$
(28)

Подставляя уравнения (27) и (28) в уравнение (17), имеем:

$$u_{p} = (A_{1} + A_{2}x + Be^{\lambda_{3}x} + Ce^{\lambda_{4}x}) - \left(\frac{Zt_{s}j\omega}{w_{p}\overline{G_{s}}}\right)(A_{2} + B\lambda_{3}e^{\lambda_{3}x} + C\lambda_{4}e^{\lambda_{4}x}).$$
(29)

Обозначив $\left(\frac{Zt_s j\omega}{w_p \overline{G_s}}\right) = \frac{1}{\overline{p}}$ величиной \overline{n} и преобразовав, получаем: $u_p = (A_1 + \overline{n}A_2) + A_2 x + B(1 + \overline{n}\lambda_3)e^{\lambda_3 x} + C(1 + \overline{n}\lambda_4)e^{\lambda_4 x}.$

Дифференцируя по переменной х, можно выразить деформацию ЦТС-пластины как

$$S_p = A_2 + B\lambda_3(1 + \overline{n}\lambda_3)e^{(\lambda_3 x)} + C\lambda_3(1 + \overline{n}\lambda_4)e^{(\lambda_3 x)}.$$
(31)

Дефектоскопия № 10 2022

где

(30)

При *x* = 0, *u* = 0 из уравнения (27) получаем:

$$A_1 = -(B + C). (32)$$

При x = 0, $u_p = 0$ из уравнения (30) выводим:

$$A_2 = -(B\lambda_3 + C\lambda_4). \tag{33}$$

Подставим уравнение (33) в уравнение (31), получаем:

$$S_{p} = B \Big[\lambda_{3} \big(1 + \overline{n} \lambda_{3} \big) e^{\lambda_{3} x} - \lambda_{3} \Big] + C \Big[\lambda_{4} \big(1 + \overline{n} \lambda_{4} \big) e^{\lambda_{3} x} - \lambda_{4} \Big].$$
(34)

При x = +l и x = -l осевая деформация в ЦТС-пластине равна свободной пьезоэлектрической деформации или Λ , благодаря чему из уравнения (34) получаем:

$$B\left[\lambda_{3}\left(1+\overline{n}\lambda_{3}\right)e^{-\lambda_{3}l}-\lambda_{3}\right]+C\left[\lambda_{4}\left(1+\overline{n}\lambda_{4}\right)e^{-\lambda_{4}l}-\lambda_{4}\right]=\Lambda,$$
(35)

$$B\left[\lambda_{3}\left(1+\overline{n}\lambda_{3}\right)e^{\lambda_{3}l}-\lambda_{3}\right]+C\left[\lambda_{4}\left(1+\overline{n}\lambda_{4}\right)e^{\lambda_{4}l}-\lambda_{4}\right]=\Lambda.$$
(36)

После решения уравнений (35) и (36) определяются константы В и С:

$$\begin{bmatrix} B\\C \end{bmatrix} = \frac{\Lambda}{(k_1k_4 - k_2k_3} \begin{bmatrix} k_4 - k_2\\k_1 - k_3 \end{bmatrix},$$
(37)

где

$$k_1 = \lambda_3 \left(1 + \overline{n} \lambda_3 \right) e^{-\lambda_3 l} - \lambda_3; \tag{38}$$

$$k_2 = \lambda_4 \left(1 + \overline{n} \lambda_4 \right) e^{-\lambda_4 l} - \lambda_4; \tag{39}$$

$$k_3 = \lambda_3 \left(1 + \overline{n} \lambda_3 \right) e^{\lambda_3 l} - \lambda_3; \tag{40}$$

$$k_4 = \lambda_4 \left(1 + \overline{n} \lambda_4 \right) e^{\lambda_4 l} - \lambda_4.$$
⁽⁴¹⁾

Благодаря толстому связующему слою $u_{(x=l)} \neq u_{p(x=l)}$, используя уравнение (17), может быть получено следующее уравнение:

$$\frac{u_{(x=l)}}{u_{p(x=l)}} = \frac{1}{1 - \left(\frac{zt_s j\omega}{w_p \overline{G}_s}\right) \frac{u'_{(x=l)}}{u_{(x=l)}}} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{\overline{p}} \frac{u'_0}{u_0}\right)}.$$
(42)

Сила, которая направлена на объект, может быть выражена следующим образом:

$$F = -Z u_{(x=l)}; \tag{43}$$

$$F = \frac{-Z}{\left(1 + \frac{1}{\overline{p}}\frac{u'_{0}}{u_{0}}\right)} j\omega u_{p(x=1)} = Z_{eq} j\omega u_{p(x=l)},$$
(44)

$$Z_{eq} = \frac{Z}{\left(1 + \frac{1}{\overline{p}}\frac{u_0'}{u_0}\right)}$$
(45)

— «эквивалентный импеданс» с учетом сдвигового запаздывания для одномерного случая.

Схожим образом, «эквивалентный импеданс» с учетом явления сдвигового запаздывания для 2D-модели, основанной на эффективном импедансе, получается как [29]:

$$z_{eff,eq} = \frac{Z_{eff}}{1 + \frac{1}{p_{eff}} \frac{u_{eff.(x=l)}}{u_{eff.(x=l)}}}.$$
(46)

ПРИМАГНИЧИВАЕМЫЙ ЦТС-ДАТЧИК (МЦД)

Для исследования стальных конструкций такой датчик был разработан сравнительно недавно. Он состоит из высокопрочного магнита, листа перспекса (оргстекла), гайки-болта и ЦТС-пластины [30], как показано на рис. 5 и рис. 6. Расположение выполнено таким образом, что ЦТС-пластина



Рис. 5. Вид спереди и вид сзади поверхности примагничиваемого ЦТС-датчика (МЦД).



Рис. 6. Модель МЦД: вид сверху(a); вид сбоку (б); изометрическая проекция (в); сборочный чертеж (г).

прикреплена к листу перспекса с помощью клея, а магниты имеют форму круглого диска, закрепленного гайкой и болтом. Они расположены таким образом, что МЩД удерживается на конструкции за счет магнита. ЦТС-пластина находится только в контакте с конструкцией, в то время как магниты левитируют в воздухе. Такое расположение исключает использование эпоксидной смолы или клеящего материала для приклеивания ЦТС-пластины к конструкции. Следовательно, исчезает эффект задержки сдвига, возникающий из-за использования эпоксидной смолы. Этот датчик является хорошим решением для метода ЭМИ, так как для приклеивания ЦТС-пластины в традиционном методе требуется достаточная квалификация, чего нельзя сказать о МЦД. МЦД можно использовать повторно, поскольку его можно легко монтировать и демонтировать на конструкции. В то же время, как при использовании обычного ЦТС-датчика, после того как он приклеен к конструкции, его невозможно отсоединить.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В данном исследовании для эксперимента была взята стальная балка двутаврового сечения достаточно большой длины 5,5 м (как показано на рис. 7, 8), с глубиной полотна, шириной фланца и толщиной 0,140 м, 0,170 м и 0,005 м соответственно. Балка находилась в состоянии простой опоры, размещаясь на бетонных блоках без боковых сил, действующих на нее. ЦТС- датчики были



Рис. 7. Стальная двутавровая балка длиной 5.5 м.



Рис. 8. Экспериментальная установка.



Рис. 9. Положение датчика и дефекта.

приклеены в местах 1, 2 и 3 (как показано на рис. 9), в тех же местах также были размещены МЦД. Повреждения были сделаны в балке с помощью фрезы, стадия повреждения 1 изображает срез фланца на глубину 0,040 м, для стадии повреждения 2 глубина была увеличена до стыка полотна и фланца. На стадии повреждения 3 обе стороны фланца были срезаны на глубину 0,040 м, а на стадии повреждения 4 эта работа продолжалась до соединения полотна и фланца. Заключительный этап повреждения 5 был выполнен в части полотна балки, разрез был выполнен до середины полотна, все повреждения показаны на рис. 10.



Рис. 10. Стадии создания дефекта: стадия 1 (а); стадия 2 (б); стадия 3 (в); стадия 4 (г); стадия 5 (д).

Для применения метода ЭМИ требуется следующее оборудование: LCR-метр Hioki IM3536 и персональный компьютер (установка показана на рис. 8). ЦТС-пластина возбуждается при помощи LCR-метра, затем эти ЦТС-пластины создают волны напряжения в конструкциях, которые возвращаются от границ или дефектов, присутствующих в деталях конструкции, обратно к ЦТС-пластине. Затем сигналы регистрируются с помощью LCR-метра в виде проводимости с изменяющейся частотой. Первое показание измерялось на начальной стадии, а затем после создания повреждений в конструкции. Эта операция была повторена для всех конфигураций датчиков, то есть для КЦД и МЦД. Все графики зависимости проводимости от частоты показаны на рис. 11—16.



Рис. 11. Зависимость проводимости от частоты для МЦД в положении 1.



Рис. 12. Зависимость проводимости от частоты для КЦД в положении 1.



Рис. 13. Зависимость проводимости от частоты для МЦД в положении 2.





КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ

Среднее квадратическое отклонение (СКО) используется для расчета разницы в значениях между исходным значением характеристики адмиттанса и при каждом из пяти состояний повреждения. СКО используют в качестве признака повреждения для количественной оценки изменений в характеристиках адмиттанса в процессе развития повреждения:

$$CKO = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (G_{i}^{1} - G_{i}^{0})^{2}}{\sum_{i=1}^{n} (G_{i}^{0})^{2}}} \times 100,$$
(46)

где G_i^1 — величина проводимости после создания в объекте *i*-го дефекта и G_i^0 — проводимость объекта в исходном состоянии, *n* обозначает количество измерений.



Рис. 15. Зависимость проводимости от частоты для МЦД в положении 3.



Рис. 16. Зависимость проводимости от частоты для КЦД в положении 3.

Обнаружение дефектов с помощью МЦД оказывается более надежным по сравнению с КЦД, так как значения СКО во всех случаях оказываются выше. В точке 1 рассматриваемый диапазон частот КЦД составляет 180—195 кГц, а для МЦД рассматриваемый диапазон частот составляет 130—180 кГц, сравнение гистограммы СКО показано на рис. 17. В точке 1, которая находится на расстоянии 0,5 м от места дефекта, изменения в характеристиках ЭМИ больше, что отражено на гистограмме СКО. Начальный уровень повреждений легко обнаруживается методом ЭМИ, при дальнейшем увеличении степени повреждения значение СКО увеличивается не так сильно. Для точки 2 диапазон частот КЦД составляет 180—195 кГц, а для МЦД — 185 — 280 кГц, сравнение гистограмм СКО показано на рис. 18. В точке 2, которая находится на расстоянии 2 м от места дефекта, значение СКО уменьшается для МЦД и КЦД по сравнению с показаниями датчиков в точке 1. В точке 3 диапазон частот КЦД составляет 190—210 кГц, а диапазон частот МЦД—200—210 кГц, сравнение гистограмм СКО показано на рис. 19. Аналогично для точки 3, которая находится на расстоянии 3,5 м от места дефекта, значения СКО датчика уменьшаются



Рис. 17. СКО для обоих датчиков в положении 1 при наличии дефекта.



Рис. 18. СКО для обоих датчиков в положении 2 при наличии дефекта.

по сравнению с датчиками, установленными в точках 1 и 2. По мере увеличения расстояния от места дефекта чувствительность датчика снижается, а для КЦД она снижается еще больше из-за эффекта сдвигового запаздывания. В этом случае между датчиком и объектом не происходит полной передачи деформации. В случае КЦД чувствительность снижается в точках 2 и 3 гораздо сильнее, поэтому для обнаружения повреждений с помощью КЦД датчик должен быть прикреплен не ближе 2 м от места повреждения. В то же время, как и в случае МЦД, чувствительность датчика снижается незначительно, поэтому его можно использовать на расстоянии до 3,5 м от места дефекта.



Рис. 19. СКО для обоих датчиков в положении 3 при наличии дефекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В методе ЭМИ исследователями были предложены различные датчики. Они имеют свои преимущества и недостатки. В данной работе сравниваются эффективность и диапазон чувствительности КЦД и МЦД. Эффективность МЦД выше, чем КЦД, из-за отсутствия эпоксидного слоя между ЦТС-пластиной и конструкцией. Из-за эпоксидного слоя в КЦД возникает эффект задержки сдвига, деформация, передаваемая ЦТС-пластиной на объект контроля и обратно, уменьшается. Область чувствительности МЦД достигает 3,5 м, в то время как область чувствительности КЦД составляет менее 2,0 м при контроле стальной балки.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kostin V., Vasilenko O., Filatenkov D. Y., Chekasina Y. A., Serbin E. Magnetic and magnetoacoustic testing parameters of the stressed-strained state of carbon steels that were subjected to a cold plastic deformation and annealing // Russian Journal of Nondestructive Testing. 2015. V. 51. No. 10. P. 624-632.

2. Kostin V., Nichipuruk A., Nikolaeva L., Sokolova S., Smorodinskii Y. G., Vasilenko O. Magnetic testing of hardness of cast railcar steel 32X06Л after quenching and high-temperature tempering // Russian Journal of Nondestructive Testing. 2016. V. 52. No. 12. P. 716—721.

3. Kostin V., Vasilenko O., Mikhailov A., Lukinykh N., Ksenofontov D. On the advantages of local measurement of coercive force of ferromagnetic objects based on internal field // Russian Journal of Nondestructive Testing. 2020. V. 56. No. 7. P. 574–580.

4. *Bhalla S., Soh C. K.* Electromechanical impedance modeling for adhesively bonded piezo-transducers // Journal of intelligent material systems and structures. 2004. V. 15. No. 12. P. 955—972.

5. Crawley E.F., De Luis J. Use of piezoelectric actuators as elements of intelligent structures // AIAA Journal. 1987. V. 25. No. 10. P. 1373–1385.

6. Sirohi J., Chopra I. Fundamental understanding of piezoelectric strain sensors // Journal of intelligent material systems and structures. 2000. V. 11. No. 4. P. 246–257.

7. Yang Y., Divsholi B.S., Soh C.K. A reusable PZT transducer for monitoring initial hydration and structural health of concrete // Sensors. 2010. V. 10. No. 5. P. 5193—5208.

8. *Tawie R., Lee H.-K.* Characterization of cement-based materials using a reusable piezoelectric impedance-based sensor // Smart Materials and Structures. 2011. V. 20. No. 8. P. 085023.

9. *Quinn W., Kelly G., Barrett J.* Development of an embedded wireless sensing system for the monitoring of concrete // Structural Health Monitoring. 2012. V. 11. No. 4. P. 381–392.

10. Kim J., Kim J.-W., Park S. Early-age concrete strength estimation technique using embedded piezoelectric self-sensing impedance / In EWSHM-7th European workshop on structural health monitoring, 2014. Inria.

11. Lu X., Lim Y.Y., Soh C.K. Investigating the performance of «Smart Probe» based indirect EMI technique for strength development monitoring of cementitious materials—Modelling and parametric study // Construction and Building Materials. 2018. V. 172. P. 134—152.

12. *Liu P., Hu Y., Chen Y., Geng B., Xu D.* Investigation of novel embedded piezoelectric ultrasonic transducers on crack and corrosion monitoring of steel bar // Construction and Building Materials. 2020. V. 235. P. 117495.

13. Pan H. H., Huang M.-W. Piezoelectric cement sensor-based electromechanical impedance technique for the strength monitoring of cement mortar // Construction and Building Materials. 2020. V. 254. P. 119307.

14. Wang D., Zhu H. Monitoring of the strength gain of concrete using embedded PZT impedance transducer // Construction and Building Materials. 2011. V. 25. No. 9. P. 3703—3708.

15. *Na S., Lee H.-K.* A multi-sensing electromechanical impedance method for non-destructive evaluation of metallic structures // Smart materials and structures. 2013. V. 22. No. 9. P. 095011.

16. Wang T., Wei D., Shao J., Li Y., Song G. Structural stress monitoring based on piezoelectric impedance frequency shift // Journal of Aerospace Engineering. 2018. V. 31. No. 6. P. 04018092.

17. Priya C.B., Saravanan T.J., Balamonica K., Gopalakrishnan N., Rao A.R.M. EMI based monitoring of early-age characteristics of concrete and comparison of serial/parallel multi-sensing technique // Construction and Building Materials. 2018. V. 191. P. 1268—1284.

18. *Moharana S., Bhalla S.* Development and evaluation of an external reusable piezo-based concrete hydration-monitoring sensor // Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 2019.V. 30. No. 18—19. P. 2770—2788.

19. *Chen D., Huo L., Song G.* EMI based multi-bolt looseness detection using series/parallel multi-sensing technique // Smart Struct. Syst. 2020. V. 25. P. 423—432.

20. *Kocherla A., Subramaniam K.V.* Embedded electrical impedance-based PZT sensor for monitoring hydrating concrete: development and evaluation // Smart Materials and Structures. 2020. V. 29. No. 5. P. 055038.

21. Negi P., Chhabra R., Kaur N., Bhalla S. Health monitoring of reinforced concrete structures under impact using multiple piezo-based configurations // Construction and Building Materials. 2019. V. 222. P. 371-389.

22. *Li W., Wang J., Liu T., Luo M.* Electromechanical impedance instrumented circular piezoelectric-metal transducer for corrosion monitoring: modeling and validation // Smart Materials and Structures. 2020. V. 29. No. 3. P. 035008.

23. Li L., Xia Y., Chen G. Experimental and numerical studies of debonding monitoring of FRP shearstrengthened beams using EMI technique // Journal of Aerospace Engineering. 2018. V. 31. No. 5. P. 04018048.

24. *Liang Y., Li D., Parvasi S. M., Kong Q., Song G.* Bond-slip detection of concrete-encased composite structure using electro-mechanical impedance technique // Smart Materials and Structures. 2016. V. 25. No. 9. P. 095003.

25. *Fan S., Li W., Kong Q., Feng Q. Song G.* Monitoring of pin connection loosening using eletromechanical impedance: Numerical simulation with experimental verification // Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 2018.V. 29. No. 9. P. 1964—1973.

26. *Guo B., Chen D., Huo L., Song G.* Monitoring of grouting compactness in tendon duct using multisensing electro-mechanical impedance method // Applied Sciences. 2020. V. 10. No. 6. P. 2018.

27.Shanker R., Bhalla S., Gupta A., Praveen Kumar M. Dual use of PZT patches as sensors in global dynamic and local electromechanical impedance techniques for structural health monitoring // Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 2011. V. 22. No. 16. P. 1841—1856.

28. *Liang C., Sun F.P., Rogers C.A.* Coupled electro-mechanical analysis of adaptive material systemsdetermination of the actuator power consumption and system energy transfer // Journal of intelligent material systems and structures. 1997. V. 8. No. 4. P. 335—343.

29. *Bhalla S., Soh C. K.* Electromechanical impedance modeling for adhesively bonded piezo-transducers // Journal of intelligent material systems and structures. 2004. V. 15. No. 12. P. 955—972.

30. PI Ceramic 2021 Product Information Catalogue (Germany: Lindenstrabe) http://www.piceramic.com